

molex

LANGUAGE JAPANESE

ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、

<u>殿</u> に納入する

1.0 mm ピッチ 基板対基板用 コネクタ について規定する。

This specification covers the 1.0mm PITCH BOARD TO BOARD CONNECTOR series .

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製 品 名 称 Product Name		製 品 型 番 Material Number
リセプタクル アッセンブリ Receptacle Assembly	無鉛 LEAD FREE	52584-***8
52584-***8 スティック梱包品 Stick Package for 52584-***8	無鉛 LEAD FREE	52584-**79
リセプタクル アッセンブリ Receptacle Assembly	無鉛 LEAD FREE	52602-**70
52602-**70 スティック梱包品 Stick Package for 52602-**70	無鉛 LEAD FREE	52602-**79
プラグ アッセンブリ Plug Assembly	無鉛 LEAD FREE	53395-***8
53395-***8 スティック梱包品 Stick Package for 53395-***8	無鉛 LEAD FREE	53395-**79
プラグ「アッセンブリ Plug Assembly	無鉛 LEAD FREE	53397-**70
5 3 3 9 7 – * * 7 0 スティック梱包品 Stick Package for 53397-**70	無鉛 LEAD FREE	53397-**79
プラグ ^ー アッセンブリ Plug Assembly	無鉛 LEAD FREE	53408-**70
5 3 4 0 8 – * * 7 0 スティック梱包品 Stick Package for 53408-**70	無鉛 LEAD FREE	53408-**79

*: 図面参照 Refer to the drawing

	REV.	Α																			
	SHEET	1~8																			
		REVIS	SE O	N P	C ON	ONLY TITLE:															
	_				見作成						1	.0 m	m Pl	тсн	ΒT	ΟВ	CON	IN.			
	Α	RELEASED J2004-3532								-LE	AD	FRE	E-			製品	仕様	書			
			'04	/04/0)2 N./	AIDA			THIS	DOCU	MENT	CON	TAINS	S INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO			0				
	REV.		D	ESC	RIPT	ION		Μ	OLEX	INC. A	ND S	HOUL	D NOT	BEU	SED V	VITHC	DUT W	RITTE	EN PEI	RMISS	ION
	DESI	GN CO	ОИТ	ROL		STA	TUS	١	WRIT		CH	IECKE	D		ROVE	D	DA	TE: `	YR/M	O/DA`	(
		J			Î				BY: BY: BY: N.AIDA K.TOJO M.SASAO					2004	4/04/	/02					
DOC		NUME	BER														FILE	E NA	ME	SI	HEET
	Р	S-52	258	4-0	03			PS52584003.doc 1 OF					OF 8								
																				EN-	37(019





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【3. 定格 RATINGS】

項 目 Item	規 Star	格 dard
最大許容電圧 Rated Voltage(MAX.)	100 V	
最大許容電流 Rated Current (MAX.)	0.5 A	[AC(実効値 rms)/DC]
使用温度範囲 Ambient Temperature Range	-55°C ~	°+85°C ^{*1}

*1:通電による温度上昇分を含む。 Including terminal temperature rise

【4. 性 能 PERFORMANCE】

<u>4-1. 電気的性能 Electrical Performance</u>

	項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement		
		コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、	嵌合高さ Mating Height	接触抵抗 Contact Resistance	
4-1-1	接触抵抗 Contact	短絡電流 10mA 以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4)	8~12mm	40 milliohm MAX.	
	Resistance	Mate connectors, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402 5.4)	13 ~ 16mm	55 milliohm MAX.	
		(013 00402 0.4)	17 ~ 20mm	70 milliohm MAX.	
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及 びターミナル、アース間に、DC 200Vを印加 し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 200V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Meg	ohm MIN.	
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及 びターミナル、アース間に、AC 200V (実効値) を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 200V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状な No Brea	きこと akdown	

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.0 mm PITCH B TO E	3 CONN.	
	Α	SEE SHEET 1 OF 8	-LEAD FREE-	製品	士様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC		NUMBER		FILE NAME	SHEET
	Ρ	S-52584-003		PS52584003.doc	2 OF 8
				EN-	37-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

<u>4-2. 機械的性能 Mechanical Performance</u>

	項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-2-1	挿入力及び抜去力	毎分 25±3 mm の速さで挿入、 抜去を行う。	挿入力 Mating Force	0.69 N {70gf} / CKT. MAX.
4-2-1	Mating and Un-mating Force	Mate and Un-mate connectors, at a rate of 25±3 mm/minute.	抜去力 Un-mating Force	0.147 N {15gf} / CKT. MIN.
4-2-2	ターミナル保持力 Terminal/Housing Retention Force	ハウジングに装着されたターミナ 毎分25±3mmの速さで引っ張る。 Apply axial pull out force on the te assembled in the housing at a rate 25±3mm/minute.	erminal	3.9 N { 0.4kgf }MIN.

<u>4-3. その他 Environmental Performance and Others</u>

	項目 Item	条件 Test Condition	Rec	規格 quirement
4-3-1	繰返し挿抜 Repeated Mate / Un-mate	1分間に10回以下の速さで挿入、抜去を 50回繰り返す。 When mate / un-mated up to 50 cycles repeatedly at a rate of 10 cycles / minute.	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm 以下 MAX. change from initial requirement: 20 milliohm
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電 し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Mate connectors and measure the temperature rise of contact when the maximum AC rated current is passed. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.0 mm PITCH B TO E	3 CONN.	
	Α	SEE SHEET 1 OF 8	-LEAD FREE-	製品(士様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC				FILE NAME	SHEET
	Р	S-52584-003		PS52584003.doc	3 OF 8
				EN-:	37-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

	項目 条件 Item Test Condition		Red	規格 quirement
		DC1mA通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な3方向に掃引割合10~55~10Hz/分、 全振幅 1.5mm の振動を各2時間加える。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-3	耐 振 動 性 Vibration	(MIL-STD-202試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA during the test. Amplitude : 1.5 mm P-P	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm 以下 MAX. change from initial requirement: 20 milliohm
		Frequency : 10-55-10 Hz shall be traversed in 1 minute. (MIL-STD-202, Method 201)	瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAX.
_		DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 6方向 に、490m/s ² {50G}の衝撃を 各3回加える。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-4	耐 衝 撃 性 Shock	(JIS C0041/MIL-STD-202 試験法 213) Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse : Half Sine	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm 以下 MAX. change from initial requirement: 20 milliohm
		Peak value : 490 m/s ² {50 G} Duration : 11 ms (JIS C0041/MIL-STD-202 Method 213)	瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAX.
		コネクタを嵌合させ、85±2 [℃] の雰囲気中 に 96時間放置後取り出し、1~2時間 室温 に放置する。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-5	耐 熱 性 Heat Resistance	 (JIS C0021/MIL-STD-202 試験法 108) Mate connectors and expose to 85±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C0021/MIL-STD-202 Method 108) 	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm 以下 MAX. change from initial requirement: 20 milliohm

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			1.0 mm PITCH B TO E	3 CONN.	
	Α	SEE SHEET 1 OF 8	-LEAD FREE-	製品	士様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	I THAT IS PROPRIET	RY TO
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC		-		FILE NAME	SHEET
	Р	S-52584-003		PS52584003.doc	4 OF 8
				EN-	37-1(019)



PS-52584-003

PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

PS52584003.doc

doc 5 OF 8 EN-37-1(019)

	項目		条件			規格	
	ltem		Test Condition		Re	quirement	
		に 96時間放 放置する。 (JIS C0020		外 Appea	観 rance	異状な No Da	
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	for 96 hours exposure pe be condition for 1 to 2 ho	ctors and expose to -55±3°C . Upon completion of the riod, the test specimens shall ed at ambient room conditions urs, after which the specified nts shall be performed.	接 触 Cont Resist	tact	初期規格 変化 20 milliol MAX. cha initial req 20 mil	量: nm 以下 nge from uirement:
			茨合させ、60±2℃ ~95%の雰囲気中に96時間	外 Appea	観 rance	異状な No Da	
4-3-7	耐 湿 性 Humidity	放置後取りと (JIS C0022/I Mate connec 60±2°C,rela	出し、1~2時間室温に放置する。 MIL-STD-202 試験法103) ctors and expose to ative humidity 90 to 95%	接触 Conf Resist	tact	初期規格 変化 20 milliol MAX. cha initial req 20 mil	量: nm 以下 nge from uirement:
		exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to2 hours, after which the specified	ned at ambient room conditions		正 ctric ngth	4-1-3項満 Must me	
		measureme	nts shall be performed. MIL-STD-202 Method103)	絶縁抵抗 Insulation Resistance		100 Me MI	
		+85±2℃に 5サイクル繰 3分以内とす する。(JISC Mate connect following con	ctors and subject to the nditions for 5 cycles. Upon	外 Appea	観 rance	異状な No Da	_
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	specimens s room conditi the specified performed. 1 cycle a) -55±3 b) +85±2	of the exposure period, the test thall be conditioned at ambient ons for 1 to 2 hours, after which d measurements shall be $^{\circ}C$ 30 minutes $^{\circ}C$ 30 minutes me shall be within 3 minutes)	接 触 Cont Resist	tact	初期規格 変化 20 milliol MAX. cha initial req 20 mil	量: nm 以下 nge from uirement:
	REVISE ON PC C	ONLY	TITLE:	D TO -	0.01		
A	SEE SHEE	T 1 OF 8	1.0 mm PITCH -LEAD FF		CON		士様書
REV.	DESCRIF		THIS DOCUMENT CONTAINS INFOR MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE U				
						ENAME	SHEET





LANGUAGE

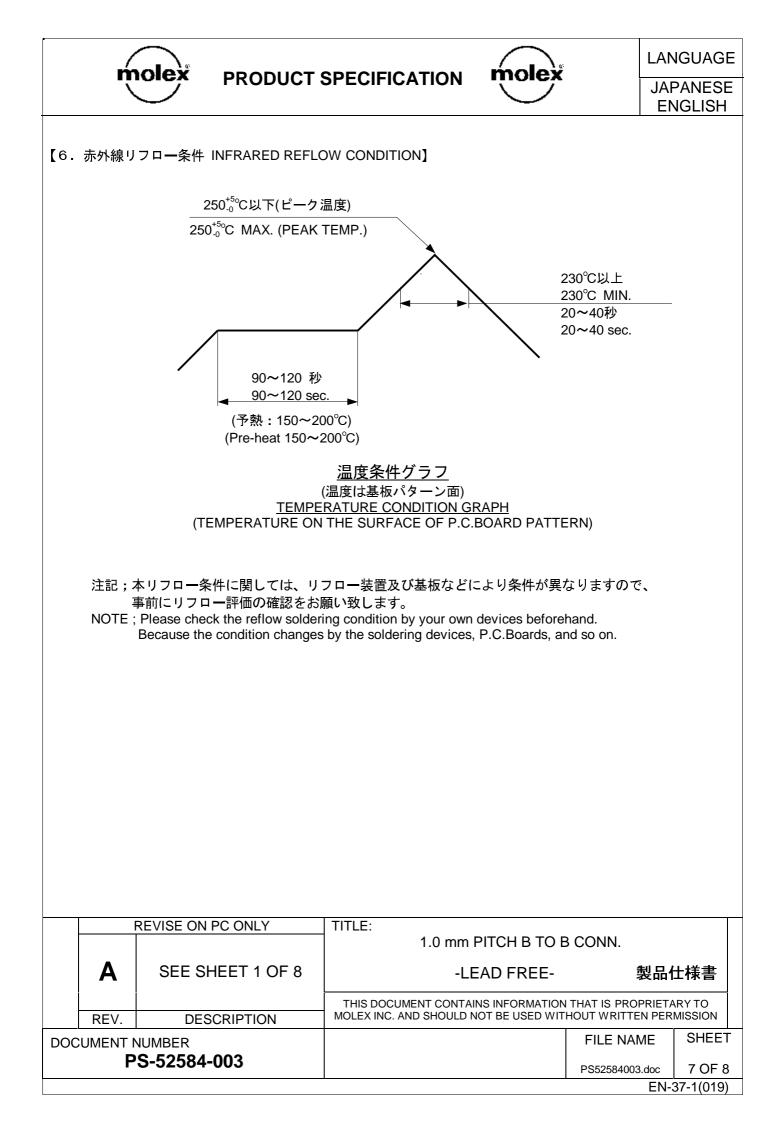
JAPANESE ENGLISH

条件 Test Condition コネクタを嵌合させ、35±2℃にて、 重量比 5±1%の塩水を48±4時間噴霧し、 試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させ る。	Rec	規格 quirement
重量比 5±1% の塩水を48±4時間噴霧し、 試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させ る。		·
(JIS C0023/MIL-STD-202 試験法 101) Mate connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48±4 hours Ambient temperature : 35±2°C (JIS C0023/MIL-STD-202 Method 101)	接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm 以下 MAX. change from initial requirement: 20 milliohm
コネクタを嵌合させ、40±2°Cにて50±5ppm	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
の亜硫酸ガス中に24時間放置する。 Mate connectors and expose to 50±5 ppm SO ₂ gas, ambient temperature 40±2°C for 24 hours.	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm 以下 MAX. change from initial requirement: 20 milliohm
端子先端より0.5mmの位置まで、245±5℃の 半田に 3±0.5秒浸す。 Dip soldertails into the molten solder (held at 245±5℃) up to 0.5mm from the bottom of the housing for 3±0.5 sec.	濡 れ 性 Solder Wetting	浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes
(リフロー時) 第6項の条件を2回繰り返す。 (When reflowing) Repeat paragraph 6, condition two times.	外 観 Appearance	端子ガタ 割れ等 異状なきこと No Damage
	<pre>completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48±4 hours Ambient temperature : 35±2°C (JIS C0023/MIL-STD-202 Method 101)</pre> a	completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48±4 hours Ambient temperature : 35±2°C (JIS C0023/MIL-STD-202 Method 101) コネクタを嵌合させ、40±2°CIこて50±5ppm の亜硫酸ガス中に24時間放置する。 Mate connectors and expose to 50±5 ppm SO ₂ gas, ambient temperature 40±2°C for 24 hours. 端子先端より0.5mmの位置まで、245±5°Cの 半田に 3±0.5秒浸す。 Dip soldertails into the molten solder (held at 245±5°C) up to 0.5mm from the bottom of the housing for 3±0.5 sec. (リフロー時) 第6項の条件を2回繰り返す。 (When reflowing) 外 観 Appearance

Reference Standard

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】 図面参照 Refer to the drawing.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:				
	Α	SEE SHEET 1 OF 8	1.0 mm PITCH B TO B CONN.				
			-LEAD FREE-		製品仕様書		
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
	REV.	DESCRIPTION					
DOC				FILE NAME	SHEET		
PS-52584-003				PS52584003.doc	6 OF 8		
	EN-37-1(019						







LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

REV.	REV. RECORD	DATE	ECN NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY
А	RELEASED	'04/04/02	J2004-3532	N.AIDA	K.TOJO

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
		SEE SHEET 1 OF 8	1.0 mm PITCH B TO B CONN.			
	Α		-LEAD FREE-		製品仕様書	
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	THAT IS PROPRIETA	RY TO	
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOC				FILE NAME	SHEET	
PS-52584-003				PS52584003.doc	8 OF 8	
EN-37-1(019)						